

Optoelectronică, structuri și tehnologii

Curs 11
2011/2012

Fotodioda

Capitolul 10

Detectori optici

▶ Cerinte

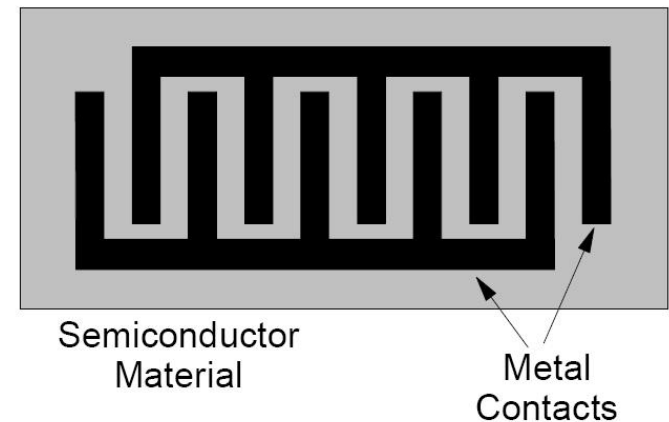
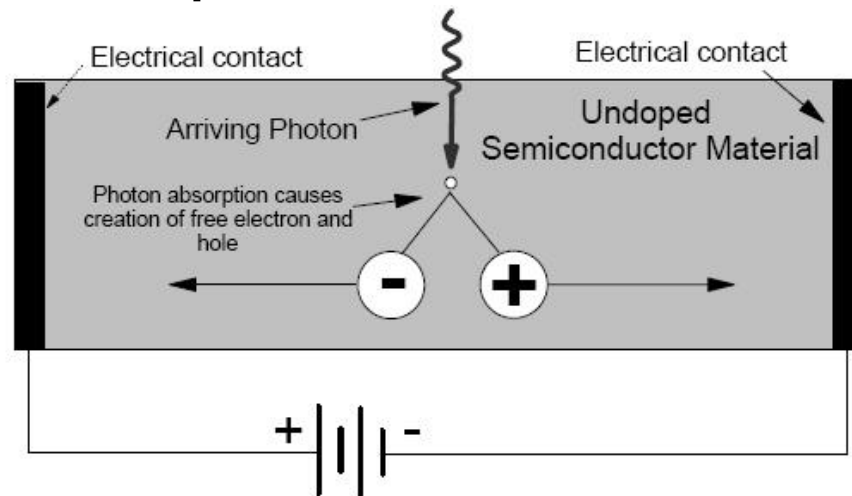
- eficienta crescuta a conversiei optic/electric
- zgomot redus
- raspuns uniform la diferite lungimi de unda
- viteza de raspuns ridicata
- liniaritate

▶ Principii de operare

- fotoconductori $R = R(P_o)$
- fototranzistori $I_B = I_B(P_o)$
- fotodiode $I = I(P_o)$
 - pn
 - pin
 - pin cu multiplicare in avalansa
 - Schottky

Fotoconductor

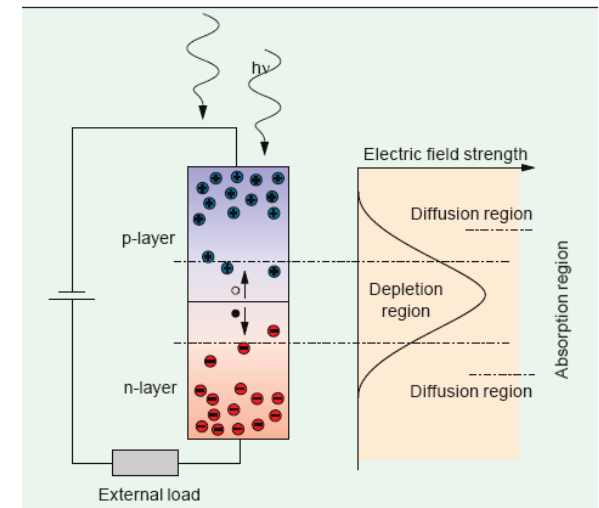
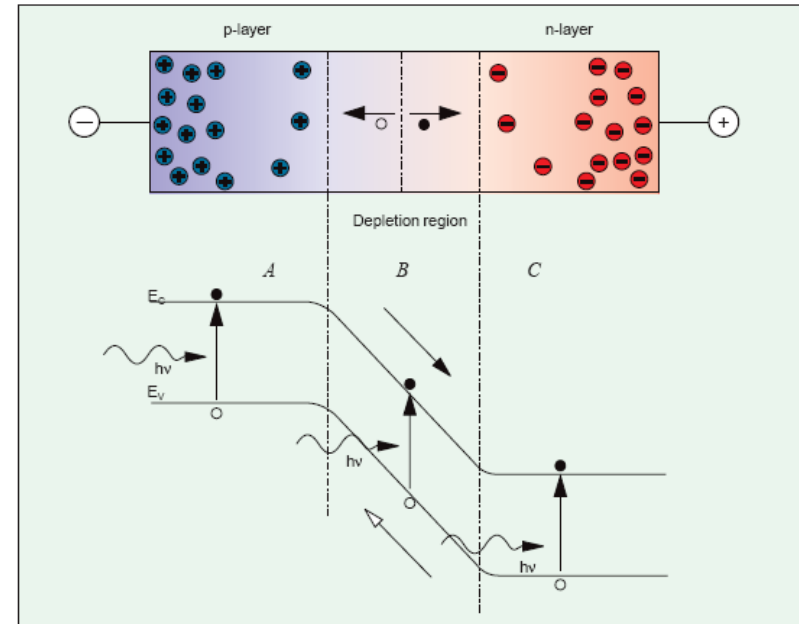
▶ Principiu



- ▶ Recent dispozitive Metal Semiconductor Metal (filtru interdigital) au inceput sa fie utilizate pentru usurinta de fabricare si integrare in aplicatii mai putin pretentioase

Fotodioda – Principiul de operare

- ▶ Jonctiunea pn este polarizata invers
- ▶ Lumina este absorbita in regiunea golita de purtatori, un foton absorbit generand o pereche electron-gol
- ▶ Sarcinile sunt separate de campul electric existent in regiunea golita si genereaza un curent in circuitul exterior



Fotodioda – Principiul de operare

- ▶ Energia necesara pentru eliberarea unei perechi electron gol

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} \geq E_g$$

- ▶ Lungime de unda de taiere

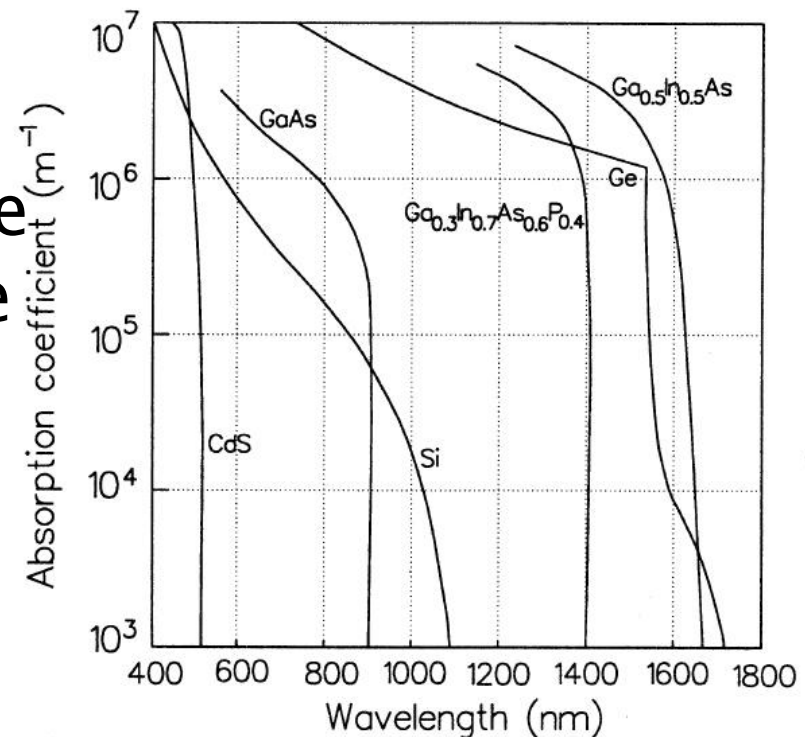
$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{E_g}$$

- ▶ Puterea optica absorbita in zona golita de purtatori (w) aflata la o adincime d in interiorul dispozitivului

$$P(w) = P_i \cdot e^{-\alpha \cdot d} \cdot (1 - e^{-\alpha \cdot w}) \cdot (1 - R_f)$$

Fotodioda – Principiul de operare

- ▶ Coeficientul de absorbtie pentru materialele uzuale
- ▶ Valoarea mare a coeficientului de absorbtie la lungimi de unda reduse implica scaderea rezponzivitatii
- ▶ Comportarea tuturor materialelor este de tip trece banda



Fotodioda – Marimi caracteristice

- ▶ Eficienta cuantica – raportul dintre numărul de perechi electron–gol generate și numărul de fotoni incidenti

$$\eta = \frac{n_e}{n_f}$$

- ▶ In unitatea de timp numarul de fotoni depinde de puterea optica, iar numarul de electroni impune curentul generat

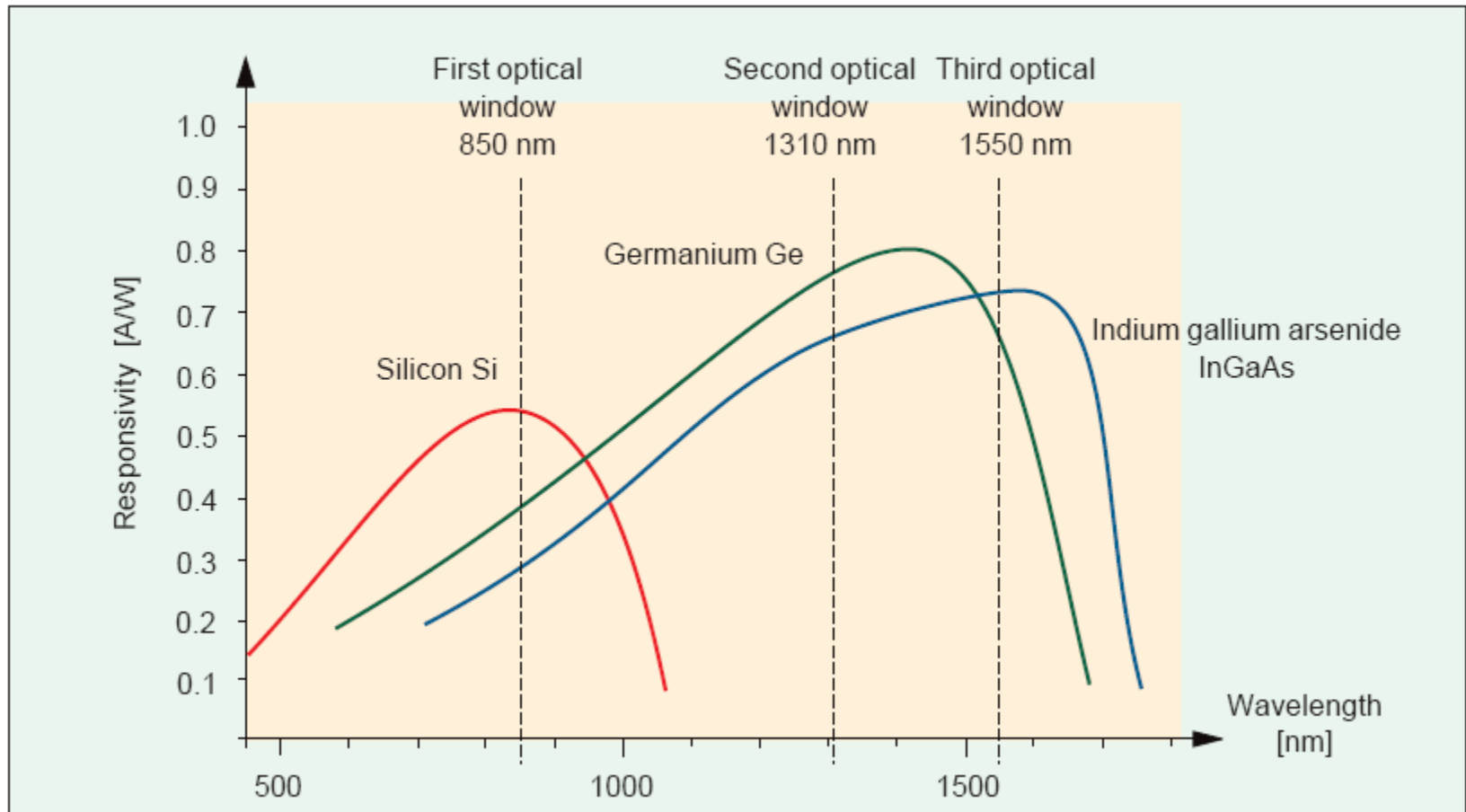
$$\eta = \frac{I/e}{P/h\nu}$$

- ▶ Responzivitatea

$$R = \frac{I}{P_o} = \frac{\eta \cdot e \cdot \lambda}{hc}$$

$$R = 0.8 \cdot \eta \cdot \lambda [\mu m] \left[\frac{A}{W} \right]$$

Materiale utilizate pentru fotodiode



Material utilizate pentru fotodiode

| Material | λ [μm] | Responsivitate [A/W] | Viteza [ns] | Curent de intuneric |
|----------|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Si | 0.85 | 0.55 | 3 | 1 |
| Si | 0.65 | 0.4 | 3 | 1 |
| InGaAs | 1.3–1.6 | 0.95 | 0.2 | 3 |
| Ge | 1.55 | 0.9 | 3 | 66 |

- ▶ Dezavantajul major pentru Ge este curentul de intuneric mare

| Material | E_g (eV) |
|---|------------|
| GaAs | 1.43 |
| GaSb | 0.73 |
| $\text{GaAs}_{0.88}\text{Sb}_{0.12}$ | 1.15 |
| Ge | 0.67 |
| InAs | 0.35 |
| InP | 1.35 |
| $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$ | 0.75 |
| $\text{In}_{0.14}\text{Ga}_{0.86}\text{As}$ | 1.15 |
| Si | 1.14 |

Curent de intuneric

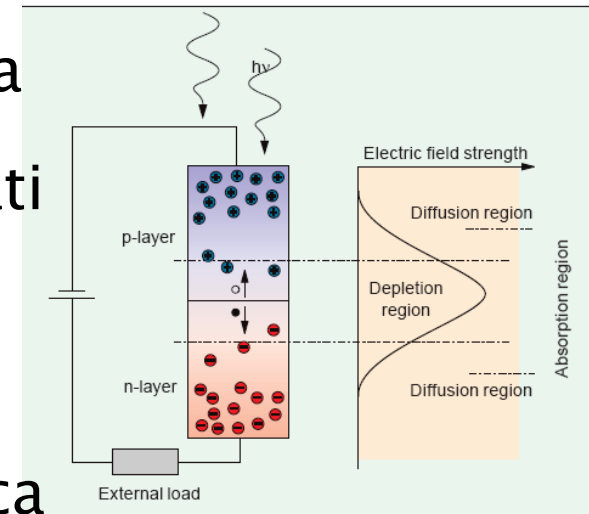
- ▶ Curentul invers al jonctiunii p-n, datorat agitatiei termice, prezent in absenta iluminarii
- ▶ Constitutie o importanta sursa de zgomot (limiteaza aplicatiile Ge)

$$I_D = I_S \approx \frac{\beta \cdot kT}{eR_0}$$

- β – coeficient de idealitate $\beta = 1 \div 2$
- R_0 – rezistenta la intuneric a diodei (invers proportionala cu aria diodei)

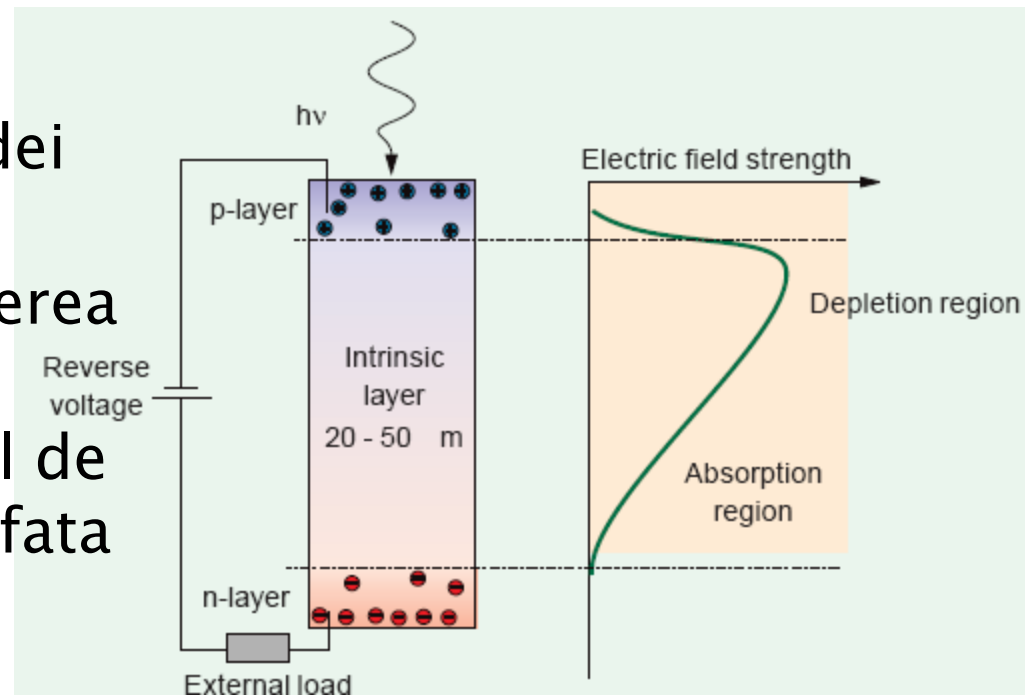
Fotodioda PIN

- ▶ Existenta campului electric in regiunea golita de purtatori face ca eventualii purtatori generati optic sa fie accelerati spre terminale pentru constituirea fotocurentului
- ▶ Problemele utilizarii diodei pn polarizate invers ca fotodetector sunt generate de adancimea extrem de mica a zonei golite (w)
- ▶ Puterea optica absorbita in interiorul acestei zone e in consecinta redusa
- ▶ Puratorii generati inafara zonei de golire ajung eventual in zona golita si vor fi accelerati spre terminale, dar viteza fenomenului este prea redusa pentru aplicatii in comunicatii



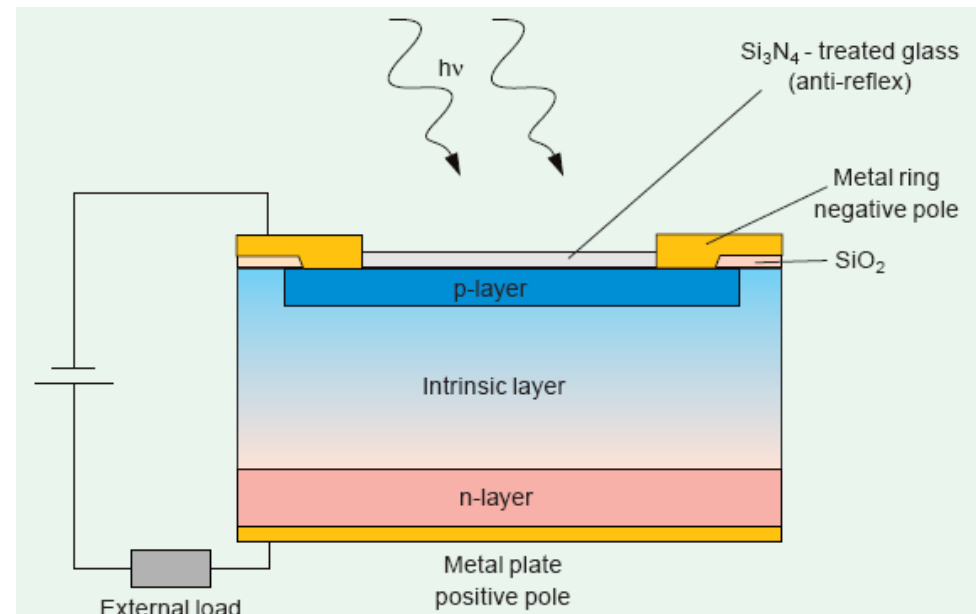
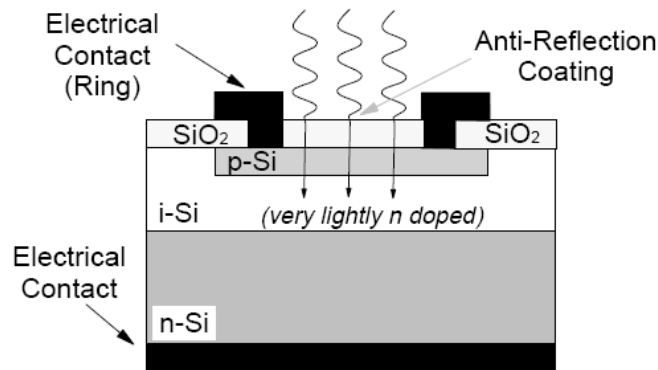
Fotodioda PIN

- ▶ Solutia consta in introducerea unui strat foarte slab dopat (intrinsec) intre cele doua zone ale diodei
 - creste volumul de absorbtie deci creste sensibilitatea fotodiodei
 - capacitatea jonctiunii scade ducand la cresterea vitezei
 - este favorizat curentul de conductie (mai rapid) fata de cel de difuzie



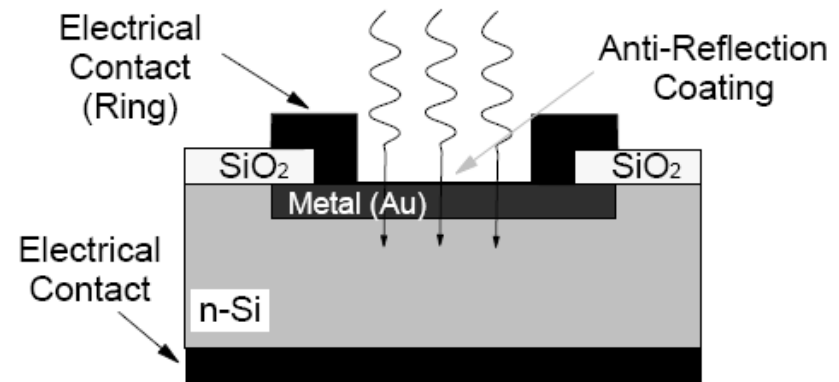
Structura fotodiodei PIN

- ▶ tipic, adancimea stratului intrinsec este de 20–50 μm
- ▶ cresterea suplimentara a adancimii ar duce la creterea timpului de tranzit
 - $w=20\mu\text{m} \rightarrow T_{tr} \cong 0.2\text{ns}$



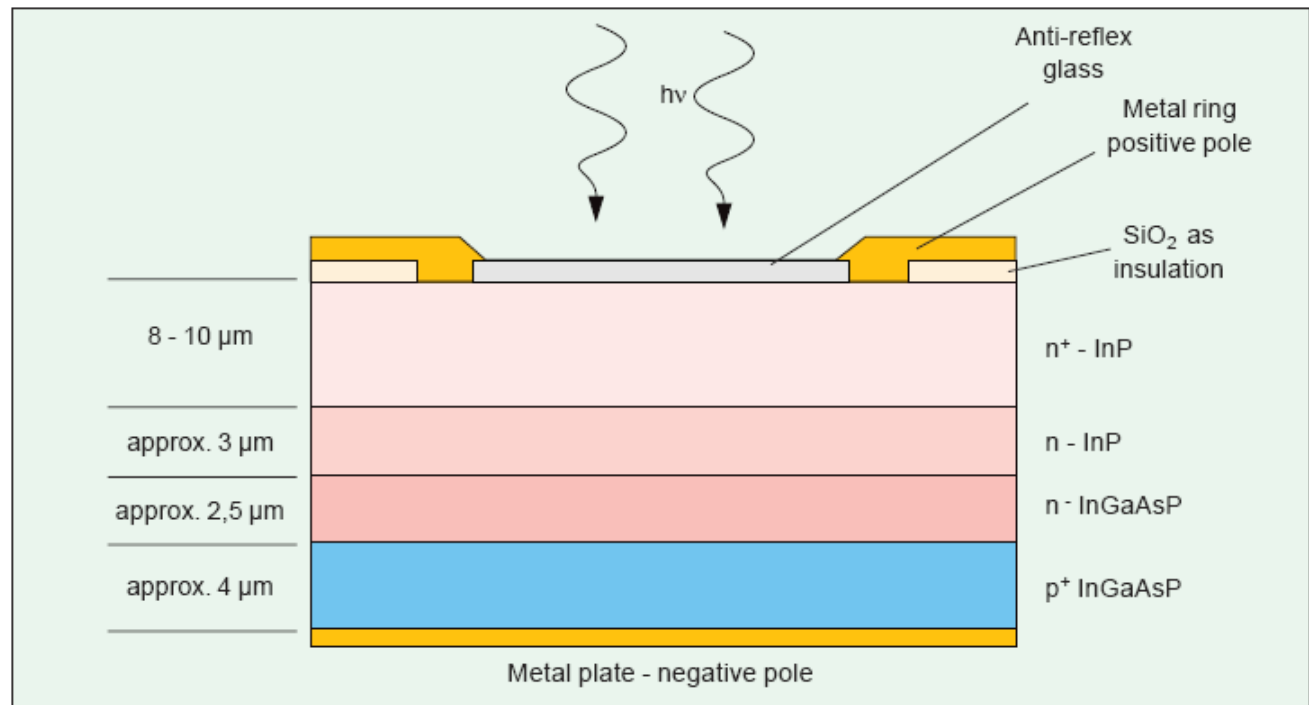
Structura fotodiodelor Schottky

- ▶ se bazeaza pe jonctiunea metal semiconductor
- ▶ vitezele de lucru sunt mult mai mari, metalul fiind un bun conductor realizeaza evacuarea mult mai rapida a purtatorilor din jonctiune
- ▶ permite utilizarea unor materiale cu eficienta mai mare dar care nu pot fi dopate simultan p si n pentru utilizare in PIN
- ▶ modulatie cu 100GHz posibila

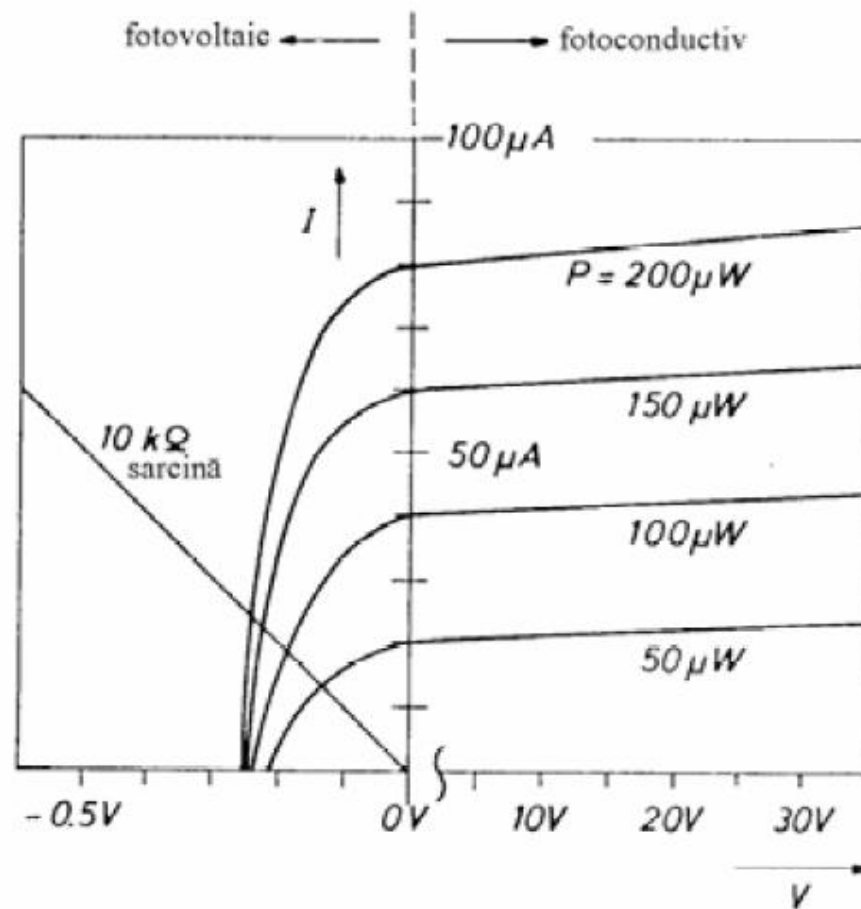


Fotodioda PIN pentru lungimi de unda crescute (1550nm)

- ▶ se utilizeaza tipic
 - InGaAsP pe substrat InP
 - GaAlAsSb pe substrat GaSb

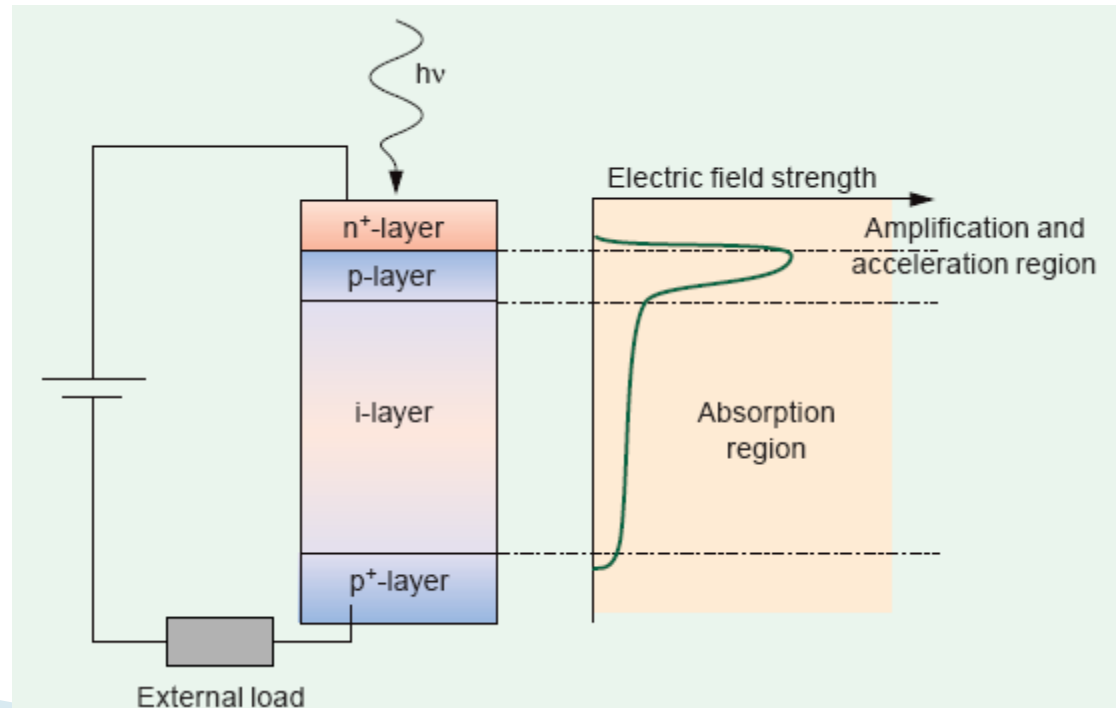
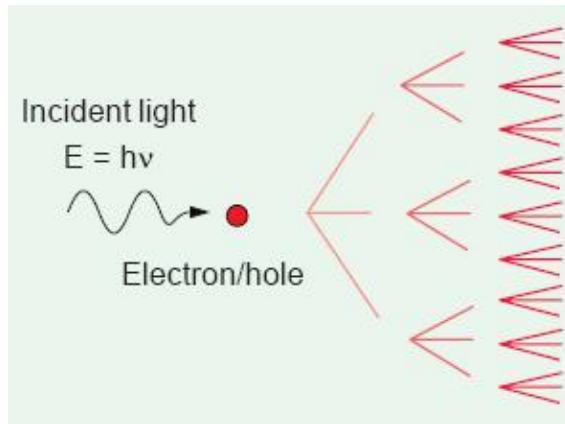


Caracteristici curent/tensiune



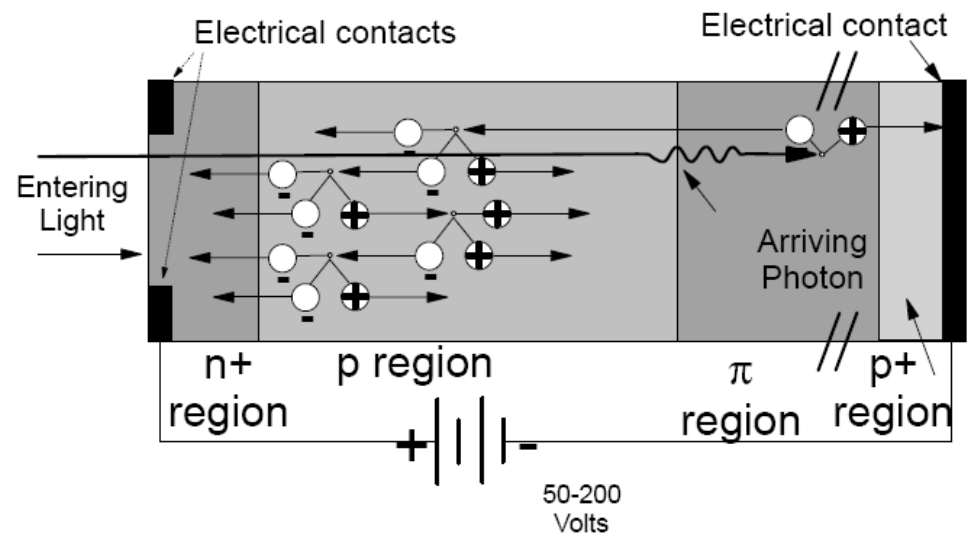
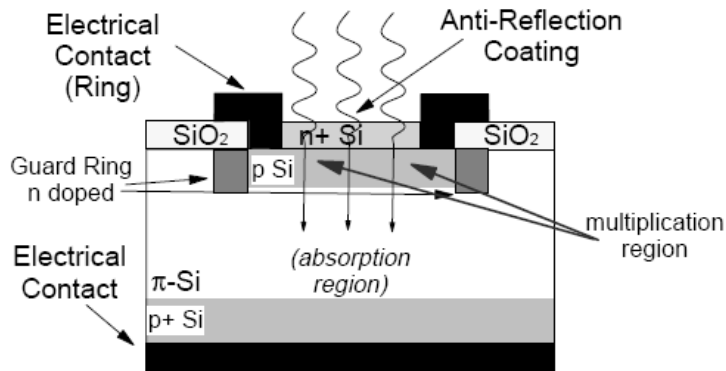
Fotodioda PIN cu multiplicare in avalansa

- ▶ daca viteza purtatorilor este suficient de mare genereaza noi perechi electron/gol prin ionizare de impact
- ▶ amplificarea are loc in acelasi timp cu detectia

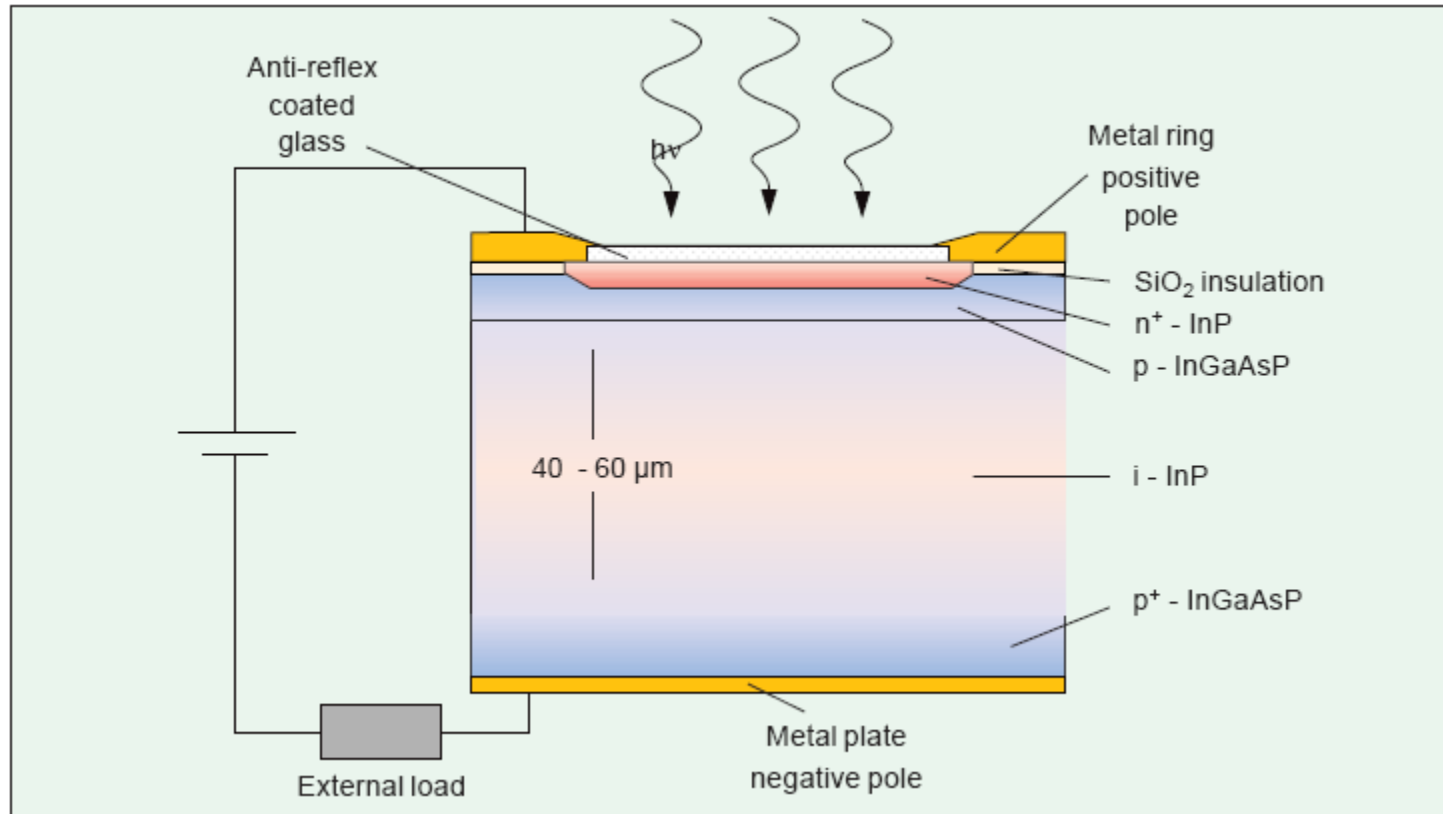


Functionarea fotodiodei cu multiplicare in avalansa

- ▶ campuri electrice de ordinul minim: 3×10^5 V/m, tipic: 10^6 V/m sunt necesare
- ▶ aceste campuri sunt generate de tensiuni inverse de polarizare de ordinul 50–300V
- ▶ structura este modificata pentru concentrarea campului in zona de accelerare



Structura fotodiodei cu multiplicare in avalansa



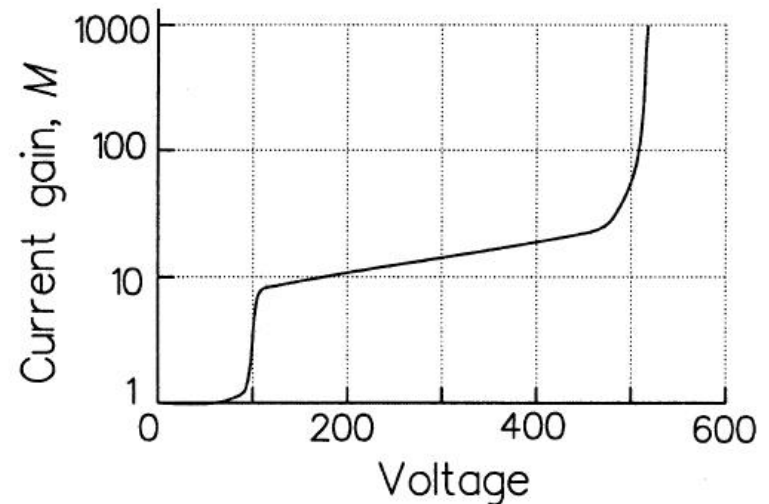
Caracteristicile fotodiodei cu multiplicare in avalansa

- ▶ factorul de multiplicare caracterizeaza amplificarea fotocurentului generat

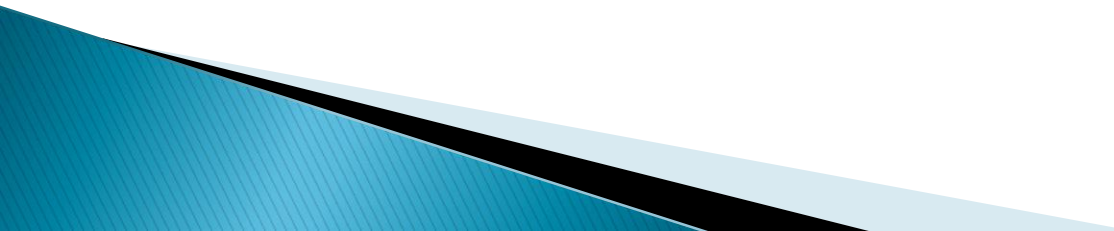
$$M = \frac{I_M}{I}$$

- ▶ Responzivitatea

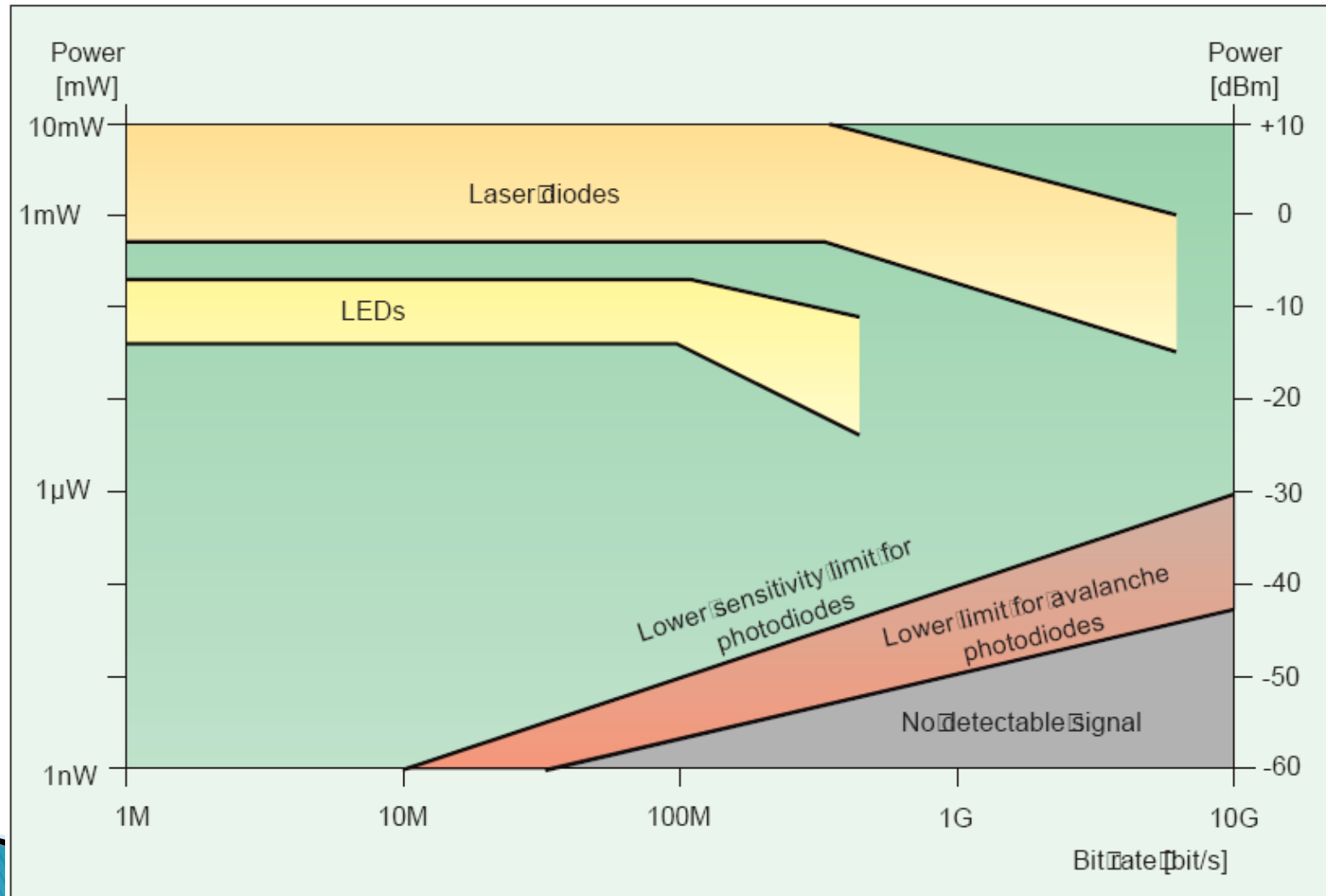
$$R = \frac{I}{P_o} = \frac{\eta \cdot e \cdot \lambda}{hc} \cdot M$$



Dezavantaje

- ▶ tensiuni inverse de polarizare mari cresc complexitatea circuitului
 - ▶ diodele cu multiplicare in avalansa sunt intrinsec mai zgomotoase (curentul de zgomot este amplificat de asemenea)
 - ▶ factorul de multiplicatie are o componenta aleatorie (zgomot suplimentar)
 - ▶ viteza mai redusa (timp de generare al avalansei)
- 

Limite putere/bandă a dispozitivelor optoelectronice



Contact

- ▶ Laboratorul de microunde si optoelectronica
- ▶ <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- ▶ rdamian@etti.tuiasi.ro